



**CUADRO DE SEGUIMIENTO de Compromisos de CARTAS DE SERVICIOS OEPM**

**Seguimiento de Carta de Servicios de INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**  
**Diciembre 2023**

<b>COMPROMISO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR REAL</b>	<b>DESVIACIÓN</b>	<b>Comentarios</b> (Causas, Medidas...)
El <b>50%</b> de los <b>Informes Tecnológicos de Patentes</b> solicitados se realizarán en menos de <b>21 días hábiles</b> desde la recepción de la información técnica completa que debe acompañar a la solicitud.	Porcentaje de Informes Tecnológicos de Patentes entregados en 21 días hábiles o menos desde la fecha de la recepción de la información técnica completa.	65,67		
El <b>100%</b> de los <b>Informes Tecnológicos de Patentes</b> solicitados se realizarán en menos de <b>60 días hábiles</b> desde la recepción de la información técnica completa que debe acompañar a la solicitud.	Porcentaje de Informes Tecnológicos de Patentes entregados en 60 días hábiles o menos desde la fecha de la recepción de la información técnica completa.	100%		
Los <b>Informes de Vigilancia Tecnológica a Medida</b> , dadas sus especiales características, se entregarán en el plazo concertado con el cliente al realizar la solicitud.	Porcentaje de Informes de Vigilancia Tecnológica a Medida entregados en el plazo establecido con el cliente al realizar la solicitud.	100%		
Las <b>búsquedas retrospectivas en bases de datos de cobertura nacional</b> se realizarán en un plazo máximo de <b>5 días hábiles</b> desde la recepción de la solicitud en la Unidad.	Porcentaje de búsquedas retrospectivas en bases de datos de cobertura nacional realizadas en 5 días hábiles o menos desde la recepción de la solicitud en la Unidad.	100%		
Las <b>búsquedas retrospectivas en bases de datos de cobertura mundial</b> se realizarán en un plazo máximo de <b>10 días hábiles</b> desde la recepción de la solicitud en la Unidad.	Porcentaje de búsquedas retrospectivas en bases de datos de cobertura mundial realizadas en 10 días hábiles o menos desde la recepción de la solicitud en la Unidad.	100%		